

セミコン・ジャパン2013のご案内

2013年11月吉日

お客様各位

日本電子材料株式会社
営業統括部長 岩下 俊治

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別なお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今年も弊社ではセミコン・ジャパンへ下記の内容で出展いたします。
ご多忙のこととは存じますが、是非ともご来場くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

日 時 : 2013年12月4日(水)~6日(金) 10:00~17:00
場 所 : 幕張メッセ 国際展示場ホール 5B-206

出展製品

MEMSタイプ

- ・MCシリーズ 狭ピッチを実現した300mmウエハ、一括測定対応のプロブカード

MEMSタイプの新技术

- ・高密度スペーストランスフォーマー
- ・Cuピラー、マイクロバンプ対応のMEMSプロブ
- ・DCパラメトリック試験対応のMEMSプロブ

VERTICALタイプ

- ・VCシリーズ 300mmウエハ、一括測定対応のプロブカード
- ・VTシリーズ 狭ピッチ、マルチレイアウト対応のプロブカード
- ・VSシリーズ ポゴピン型、ソルダーバンプ対応のプロブカード
- ・VEシリーズ カンチレバー型、イメージセンサ対応のプロブカード

CANTILEVERタイプ

- ・CEシリーズ パワー半導体向けダイナミック試験(動特性)対応のプロブカード
- ・CNシリーズ 狭ピッチ、マルチレイアウト(N個飛び)対応のプロブカード

高周波タイプ

- ・SAWフィルタ対応プロブカード

社員一同、皆様のご来場心よりお待ちしております。

以上



Your Probing Partner